



Workshop

Materiales escala nano mediante perfilometría óptica 3D

Pro-Lite Technology Iberia, junto con su socio tecnológico Sensofar Metrology, le invitan a participar en la jornada de "**Materiales escala nano mediante perfilometría óptica 3D**". Esta jornada va dirigida a todos aquellos que utilizan o estén pensando en utilizar perfilometría óptica para la caracterización de materiales y que deseen conocer las nuevas tendencias en este campo, tal como experimentar con un perfilómetro 3D en directo.

Dentro de las sesiones prácticas, se invitará a los asistentes a participar con sus propias muestras para comprobar el potencial de las tecnologías actuales.

Programa



20 Abril 2017



Ubicación:

Servicios Generales de Investigación de la
Universidad de Sevilla
Edificio Citius
Avenida Reina Mercedes, 4 - Sevilla



Regístrese en
info@pro-lite.es

- 10:00 Entrega acreditaciones
- 10:20 Introducción
- 10:30 Técnicas de metrología óptica: Confocal, Interferometría y Variación de Foco
- 11:30 *Coffee break*
- 11:45 Aplicaciones resueltas con perfilometría óptica
- 12:15 **Bloque Práctico** – Sesión de demostración con el perfilómetro 3D, S neox
- 13:45 Entrega de certificados de asistencia
- 14:00 Fin de la jornada

Organizadores

PRO-LITE
TECHNOLOGY

SENSOFAR.
METROLOGY



ANDALUCÍA TECH
Campus de Excelencia Internacional
Campus of International Excellence